Título: **Redes Bayesianas para Previsão de Falhas em Discos Rígidos**

Data: **25/08/2017** Horário: **14h** Local: **Sala de Seminários - Bloco 952 - Campus do Pici**

Resumo:

A capacidade de prever falhas em discos rígidos tornou-se um dos grandes objetivos de fabricantes de tais equipamentos visto que falhas inesperadas podem acarretar em significativas perdas de dados. Como consequência, este tópico de pesquisa tem atraído muita atenção em anos recentes. Atualmente, a maioria dos discos rígidos está equipada com um sistema de monitoramento de falhas denominado Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART). Este sistema coleta diversos parâmetros relativos ao desempeno do equipamento e detecta anomalias utilizando um método baseado em violação de limiares. Apesar da grande popularidade do sistema SMART, estudos recentes mostram que somente 3% a 10% das falhas são identificadas previamente. Com isso, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos como alternativas ao SMART. Este trabalho apresenta um novo método para previsão de falhas com base em Redes Bayesianas, e utilizando os parâmetros coletados pelo sistema SMART. Para a demonstração da efetividade do método proposto, foram realizados experimentos em um conjunto de dados contendo 49.056 discos rígidos.

Banca:

- Prof. Dr. Javam de Castro Machado (MDCC/UFC - Orientador)
- Prof. Dr. João Paulo Pordeus Gomes (UFC - Coorientador)

- Prof. Dr. José Antônio Fernandes de Macêdo (MDCC/UFC)
- Prof. Dr. Leonardo Ramos Rodrigues (IAE)